

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年9月29日 (29.09.2005)

PCT

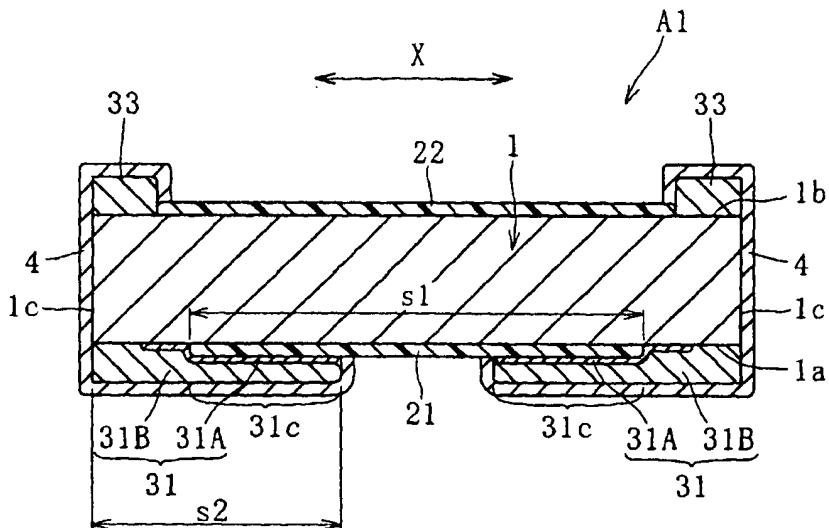
(10) 国際公開番号
WO 2005/091310 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01C 3/00, 17/00
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/005190
(22) 国際出願日: 2005年3月23日 (23.03.2005)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2004-086752 2004年3月24日 (24.03.2004) JP
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ローム
株式会社 (ROHM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6158585 京都
府京都市右京区西院溝崎町21番地 Kyoto (JP).
(72) 発明者: および
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 谷村 政憲 (TAN-
IMURA, Masanori) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市
右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP).
塚田 虎之 (TSUKADA, Torayuki) [JP/JP]; 〒
6158585 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地
ローム株式会社内 Kyoto (JP). 田中 幸作 (TANAKA,
Kousaku) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市右京区西
院溝崎町21番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP).
(74) 代理人: 吉田 稔, 外 (YOSHIDA, Minoru et al.);
〒5430014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町2番
32-1 301 Osaka (JP).
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

/統葉有/

(54) Title: CHIP RESISTOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: チップ抵抗器およびその製造方法



(57) Abstract: A chip resistor (A1) is provided with a chip-shaped resistor (1), two electrodes (31) provided apart from each other on a bottom plane (1a) of the resistor, and an insulating film (21) provided between the two electrodes. Each electrode (31) is provided with an overlapping part (31c) that overlaps with the insulating film (21) when viewed in a vertical direction.

(57) 要約: チップ抵抗器 (A1) は、チップ状の抵抗体 (1) と、この抵抗体の底面 (1a) に相互に離間して設けられた2つの電極 (31) と、これら2つの電極間に設けられた絶縁膜 (21) と、を備えている。各電極 (31) は、上下方向に見た場合において絶縁膜 (21) と重なり合うオーバーラップ部 (31c) を有している。

WO 2005/091310 A1



IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:
— 國際調査報告書